



飯竹 昌則 Masanori Iitake

FIB ひと筋？ 25年、
5機種のFIB,FIB-SEMの経験があります。

民間企業での経験は、半導体集積回路の故障解析を14年

- ・ System-on-a-ChipのMOSFETと多層配線の故障原因を特定し、改善方法を提案して歩留まり向上を図る業務を行っていました。

「使用していた解析装置は、FIB, SEM, Photon Emission Microscope, Optical Beam Induced Current, Liquid Crystal method, Electron Beam Tester, LSI Tester, Semiconductor Parameter Analyzer, In Line Monitorなど。」

ナノテク支援(ナノプロセッシング施設)の経験は、2003年8月～

- ・ 主にFIB, FIB-SEMによる微細加工に従事していますが、他にデバイスパラメータ評価装置やデバイス容量評価装置の担当をしています。

(過去には分光エリプソメータ、ワイヤーボンダー、ダイシングソー、アルゴンミリング装置の担当など。)

自己PR：夏祭りの時期は子供たちに和太鼓を教えています。